

JB

中华人民共和国机械行业标准

电力半导体器件和整流设备 (4)

中华人民共和国机械工业部 发布

目 录

JB/T 4192—1996	双向晶闸管	(1)
JB/T 4277—1996	电力半导体器件包装	(13)
JB/T 7786—1995	电力半导体器件检验抽样方法	(19)
JB/T 7826. 2—1996	MTQ(MFQ)系列晶闸管单相桥模块	(29)
JB/T 7826. 3—1996	MTS(MFS)系列晶闸管单相桥模块	(37)
JB/T 8320—1996	电力半导体器件工艺用涂层石英玻璃管	(45)
JB/T 8453—1996	半导体变流器 第5部分 不间断电源设备用开关(UPS 开关)	(50)
JB/T 8454—1996	高频晶闸管	(63)

电力半导体器件检验抽样方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了计数型一次抽样方案、追加抽样方案及抽样程序。

本标准适用于电力半导体器件(包括模块、组件和附件)的出厂(或逐批)检验、型式(或周期)试验和交收检验。

2 引用标准

GB 2828	逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829	周期检查计数抽样程序及抽样表
GB 4589.1	半导体器件 分立器件和集成电路总规范

3 术语

3.1 单位产品

为实施抽样检查的需要而划分的基本单位。
例如：一只器件、一个部件、一组产品等。

3.2 检查批(简称：批)

为实施抽样检查汇集起来的产品。

3.3 批量(N)

批中所包含的单位产品数。

3.4 样本单位

从批中抽取用于检验的单位产品。

3.5 样本

样本单位的全体。

3.6 样本大小;样品量(n)

样品中所包含的样品单位数。

3.7 不合格

单位产品的质量特性不符合规定。

3.8 不合格品

有一个或一个以上不合格的单位产品。

3.9 每百单位产品不合格品数;批质量(p)

批中所有不合格品数 D 除以批量 N, 再乘以 100, 即:

$$\text{每百单位产品不合格品数} = \frac{\text{批中不合格品总数}(D)}{\text{批量}(N)} \times 100$$

3.10 过程平均(\bar{p})

一系列初次提交检验批的批质量平均值。

注：初次提交检验批不包括第一次提交检验判为不合格，经返工后再次提交检验的批。